Dall'11 al 14 maggio 2015 si svolgerà a Pisa, al Palazzo dei Congressi, la trentaduesima edizione della "IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference", sponsorizzata dalla IEEE Instrumentation and Measurement Society, con il patrocinio dell'Università di Pisa, del Comune di Pisa, del Comune di Calci, il contributo di numerosi sponsor come Italcertifer, ECM, Instrument Technology Research Center, National Instruments e di espositori tra cui CRC Press, NARDA Safety Test Solutions, Rohde & Schwarz e Zurich Instruments.

Lunedì 11 maggio sono previsti una serie di tutorial su tematiche di base e applicative nell'ambito delle misure.

L'apertura delle sessioni scientifiche è prevista martedì 12 maggio con Nigel Lockyer, direttore del "Fermi National Accelerator Laboratory", che terrà un intervento dal titolo "An open window on measurements in particle physics". Mercoledì 13 maggio le sessioni scientifiche saranno invece aperte dalla presentazione in plenaria "Fast Near-Field Measurement Techniques for Characterization of Radiating Systems" da parte del professore emerito Jean-Charles Bolomey, vincitore del 2015 IEEE Joseph R. Keithley Award in Instrumentation and Measurement e giovedì 14 maggio dalla presentazione in plenaria "Measurements for Certification of Railway Systems" da parte dell'ing. Carlo Carganico, amministratore delegato di Italcertifer.

Il programma prevede presentazioni scientifiche e tecniche su ampie tematiche che spaziano da fondamenti delle misure a tecniche avanzate di misura in ambito scientifico e industriale, come dettagliato nel sito ufficiale http://imtc.ieee-ims.org/ . Alla conferenza sono attesi più di 400 partecipanti provenienti da oltre 45 paesi.